

**MEASUREMENT OF RADIATION EXPOSURE IN
DIAGNOSTIC X-RAY ENERGY RANGE USING
PHOTOSTIMULABLE PHOSPHOR PLATE**



**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
MASTER OF SCIENCE
(RADIOLOGICAL TECHNOLOGY)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY**

2008

COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

การวัดปริมาณรังสีในช่วงพลังงานเอกซเรย์วินิจฉัย โดยอาศัยแผ่นเรืองแสงชนิดกระตุ้นด้วยแสง
(MEASUREMENT OF RADIATION EXPOSURE IN DIAGNOSTIC X-RAY ENERGY RANGE USING PHOTOSTIMULABLE PHOSPHOR PLATE)

วิวัฒน์ โอวศิริกุล 4836645 MTRT/M

วท.ม. (รังสีเทคนิค)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: ชาลิต วงษ์เอก M.Sc. (Physics), มานัส มงคลสุข วท.ม. (ฟิสิกส์)

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาวิธีการใช้แผ่นรับภาพของเครื่องถ่ายภาพทางรังสีระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือวัดปริมาณรังสีเอกซเรย์ในช่วงความต่างศักย์ตั้งแต่ 40 ถึง 120 กิโลโวลต์ ค่าพิกลของแผ่นรับภาพถูกคำนวณเป็นปริมาณรังสีโดยใช้สมการของบริษัทฟูจิ และเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดรังสีชนิดแตกตัวเป็นประจุขนาด 6 ซีซี นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้แผ่นรับภาพเช่น การสูญหายของค่าพิกล ผลกระทบจากคาสเซตที่มีต่อค่าพิกล พื้นที่ฉายรังสี และพื้นที่เลือกค่าพิกลอีกด้วย

จากการศึกษาพบว่า การสูญหายของค่าพิกลน้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 10 นาที หลังจากแผ่นรับภาพถูกฉายรังสี ค่าพิกลของแผ่นรับภาพชนิดไม่มีคาสเซตมีค่าน้อยกว่าชนิดมีคาสเซตประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ปริมาณรังสีที่คำนวณได้ของแผ่นรับภาพชนิดไม่มีคาสเซตมีค่าน้อยกว่าชนิดมีคาสเซตประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพื้นที่ฉายรังสีที่จะพบว่า ค่าพิกลลดลงเล็กน้อยเมื่อพื้นที่เลือกค่าพิกลมากขึ้น ส่งผลให้ค่าปริมาณรังสีที่คำนวณได้มีค่าลดลงเล็กน้อยตามไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดรังสีชนิดแตกตัวเป็นประจุพบว่า ค่าปริมาณรังสีที่คำนวณได้จากการเลือกค่าเฉลี่ยพิกลที่ 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ฉายรังสี ของแผ่นรับภาพขนาดเล็กชนิดไม่มีคาสเซตมีค่าใกล้เคียงมากที่สุด และมีค่าลดลงที่พลังงานเอกซเรย์ต่ำแต่สูงขึ้นเล็กน้อยที่พลังงานเอกซเรย์สูง

ค่าปริมาณรังสีที่คำนวณได้จากค่าพิกลขึ้นอยู่กับพื้นที่เลือกค่าพิกลและพลังงานบางช่วงของรังสีเอกซเรย์ การเลือกใช้แผ่นรับภาพขนาดเล็กชนิดไม่มีคาสเซตกับการเลือกค่าเฉลี่ยพิกลที่ 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ฉายรังสี และการคูณด้วยค่าแก้พลังงานรังสีแล้ว พบว่าสามารถนำมาใช้วัดปริมาณรังสีเอกซเรย์ในช่วงความต่างศักย์ตั้งแต่ 40 ถึง 120 กิโลโวลต์ ภายใต้อายุการใช้งาน 4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเครื่องมือวัดปริมาณรังสีชนิดแตกตัวเป็นประจุ

51 หน้า

MEASUREMENT OF RADIATION EXPOSURE IN DIAGNOSTIC X-RAY ENERGY RANGE USING PHOTOSTIMULABLE PHOSPHOR PLATE

WIWAT OWASIRIKUL 4836645 MTRT/M

M.Sc. (RADIOLOGICAL TECHNOLOGY)

THESIS ADVISOR: CHAVALIT WONGSE-EK, M.Sc. (PHYSICS),
MANUS MONGKOLSUK, M.Sc. (PHYSICS)**ABSTRACT**

The purpose of this study was to examine a method using a photostimulable phosphor plate (PSP plate) of computed radiography (CR) system as a detector for exposure measurement under x-ray beam at potential voltages from 40 to 120 kVp. A pixel value (PV) of the exposed PSP was converted to exposure using Fuji's equation and compared with the exposure measured from a calibrated 6 cc ionization chamber. The factors affecting the PSP plate such as fading, cassette, PSP size, exposed area and selected region of interest (ROI) area were also investigated.

The results showed that the fading effect of the PV reading was less than 3% within 10 minutes after irradiation. The PV reading of the PSP exposed without cassette was lower than the reading with a cassette by approximately 1%. As a result, the exposure calculated of the PSP exposed without cassette was lower by about 9%. At a fixed exposed area the PV was slightly decreased with increasing the ROI area selected. As a result, the exposure calculated was slightly decreased while the ROI area selected was increased. Compared to the ionization chamber, the exposure calculated of small PSP size without cassette with ROI area selected of 80% of exposed area showed the best agreement and indicated lower exposure at low kVp but slightly higher at high kVp.

The radiation exposure calculated from the PV depends on the ROI area selected and some kVps. The dosimeter using the small PSP size without cassette, selection of ROI area at 80% of exposed area and multiplication of correction factor for energy dependence can measure radiation exposure from 40 to 120 kVp x-ray beam within an accuracy $\pm 4\%$ of ionization chamber.

**KEY WORDS: COMPUTED RADIOGRAPHY / PHOTOSIMULABLE PHOSPHOR -
PLATE / RADIATION EXPOSURE / PIXEL VALUE**

51P.